

USB Digitalmikroskop 5 MP 10-140x LWD mit EDOF und Polfilter - Dino-Lite AM7915MZTL

Artikel-Nr. AM7915MZTL

Hersteller Dino-Lite

EAN 4712805476855

Das AM7915MZTL verbindet erweiterte Schärfentiefe mit großem Arbeitsabstand. Bei 10-140x hält EDOF unebene Objekte durchgehend scharf, der große Arbeitsabstand schafft Platz für Nacharbeit und der eingebaute Polfilter unterdrückt Reflexionen auf glänzenden Oberflächen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
ESD-Ausrüstung	USB Mikroskop
Gewicht	0.13 kg
Zolltarifnummer	90118000



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

ERWEITERTE SCHÄRFENTIEFE MIT GROSSEM ARBEITSABSTAND

Das Dino-Lite AM7915MZTL kombiniert zwei Stärken: Extended Depth of Field (EDOF) für durchgehend scharfe Bilder unebener Objekte und einen großen Arbeitsabstand (LWD), der zwischen Optik und Probe Platz lässt. Das erleichtert die Inspektion und Nacharbeit dreidimensionaler Bauteile bei 10-140x.

WESENTLICHE VORTEILE

- 5-Megapixel-Sensor mit 10-140x optischer Vergrößerung und großem Sichtfeld.
- Extended Depth of Field (EDOF) für durchgehend scharfe Bilder unebener Oberflächen.
- Großer Arbeitsabstand (LWD) für freien Zugang zur Probe.
- Extended Dynamic Range (EDR) reduziert Überstrahlung, eingebauter verstellbarer Polfilter unterdrückt Reflexionen.
- Automatische Vergrößerungsablesung (AMR) und Flexible LED Control (FLC) für Messung und gerichtete Ausleuchtung.

ANWENDUNGEN

Nacharbeit und Inspektion dreidimensionaler Leiterplatten und Bauteile, Prüfung in beengten Aufbauten sowie Material- und Oberflächenanalyse mit Bedarf an freiem Arbeitsraum.

KOMPATIBILITÄT

Das Edge-Frontkappensystem (N3) erlaubt ESD-sichere Kappen, Ringlicht oder Koaxiallicht. Stative der MS- und RK-Reihe sowie der Fußschalter sorgen für reproduzierbare Aufnahmen.

NORMEN UND HERKUNFT

Hergestellt in Taiwan. Lieferung mit DinoCapture-2.0-Software.